

# تصنيع كاشف التوصيلية الضوئية CdTe ودراسة بعض الخواص الكهربائية لبلورة CdTe

صلاح عبد الله حسون . . . زiad طارق الدهان . . .  
اسمها اسعد محمود . . .

تاریخ قبول النشر ٢٩/٩/٢٠٠٤

## خلاصة

تم تصنيع كاشف التوصيلية الضوئية على نمط تماش معن شبه موصل وذلك عن طريق ترسيب صلب من معن الأستينوم على رفاق من بلورة الكادميوم تلرايد (CdTe) ذات الاتجاهية [111] والمنماة محترباً ولملونة بدرجة حرارة  $80^{\circ}\text{C}$  ولمدة 30min وتناول البحث دراسة بعض الخواص الكهربائية لسمرة والكشفية للنمذاج المنشوبة بالتحاص مع النماذج غير المشوبة لمعرفة تأثير التشويب فيها كذلك يتضمن البحث تأثير التشويب والتزدد على مقاومة الكاشف .

## المقدمة

(HgCdTe Photo diod) (الضوئية) [3] وتستخدم هذه الكواشف في مجالات متعددة إذ يمكن الاستفادة من هذه الكواشف في انظمة اتصالات الامواج البصرية التي تعمل في المنطقة تحت الحمراء القريبة ( $\lambda = 0.8-1\text{ }\mu\text{m}$ ) [4].

### الجانب النظري

تعرف الكواشف على انها اجهزة تعمل على تحويل الطاقة الضوئية الساقطة الى اشارة كهربائية يمكن قياسها [5]. يمكن تصنيف الكواشف البصرية على اساس تفاعل موجة الاشعاع الكهرومغناطيسي مع الكترونات المادة الى كواشف حرارية وكواشف فوتونية بالنسبة للكواشف الحرارية فان امتصاص طاقة الضوء الساقط يرفع درجة حرارة الكاشف الذي يدوره يسبب تغيرات في عامل ما يعتمد على درجة الحرارة للتوصيلية الكهربائية مثلاً لذا فان الخرج (out put) للكواشف الحرارية يتضاسب مع كمية الطاقة الممتصة في وحدة الزمن من قبل الكاشف ولا يعتمد هذا المنتوج على طول

تعتبر مادة الكادميوم تلرايد من المركبات شبه الموصلة التي تتضمن الى مجموعه ثنائية سداسية (II-VI) حيث يمتلك عنصر الكادميوم إلكترونين في مداره الخارجي بينما يمتلك عنصر التلرايد ستة إلكترونات في مداره الخارجي . إن التركيب البلوري لهذه المركبات هو تركيب ركائز الزنك (Zinc-Blende) وبتأثر الشبيكة لهذا المركب هو ( $A_8L_{6.48}$ ) عند درجة حرارة الغرفة [1].

المركب ذو فجوة طاقة مباشرة بحدود 1.45 eV في درجة حرارة  $25^{\circ}\text{C}$  ويكون الطول الموجي المقابل لفجوة الطاقة هذه هو 800nm [2] تغير بلورة الكادميوم تلرايد من البلورات المهمة في العديد من التطبيقات الفيزيائية حيث تعتبر من المواد الواعدة في مطابيق الأشعة السينية وأشعة كاما (Gamma-And X-rays) كما تستخدم هذه البلورات في المصادر الكهربائية-البصرية (Electro optic modulators) من التطبيقات المهمة الأخرى لهذه البلورات هي استخدامها كقواعد في كواشف الإشعة تحت الحمراء خاصة لثانيات

\* دكتوراه-استاذ مساعد قسم الفيزياء كلية العلوم للبنات -جامعة بغداد

\*\* دكتوراه-قسم هندسة الليزر والالكترونيات-جامعة النهرين  
مطالبة ماجستير

(T05) باستخدام مادة معجون الفضة (silver past) وبعدها توضع العينات في فرن بدرجة حرارة (80<sup>0</sup>) ولمدة 30min لفرض ربط الأسلاك بالنمودج تم استخدام ماكينة ربط الأسلاك فوق الصوتية من نوع (bhi) helnut ونقوم بوضع اغلفة (cups) لتغليف العينات والمحافظة عليها. انفائدة عملية التلدين هي الحصول على توصيل اومي جيد ولتحسين التوصيل الكهربائي بين المعدن وشبكة الموصى وفائدة اخرى هي انتشار ذرات المادة شبه الموصلة خلال المعدن حيث ان ذرات المعدن تتصرف وكأنها وادية او مانحة تنتشر خلال شبكة الموصى حسب نوع المعدن [10].

من أجل تثويب سطح البلور تم استخدام نحاس بنقاوة 99,99% وذلك بتثويب طبقة سمكها 1 mm على الشرائح بواسطة جهاز التثثير الحراري في الفراغ بضغط  $10^{-5}$  mbar

القياسات القياسية

لدراسة بعض الخواص الكهربائية المستمرة والمتناوبة للنماذج المحضررة وضع الكاشف ضمن دائرة كهربائية تحتوي على أمبير ومجهز قدرة لقياس تيار الظلام وتيار الأضاءة كدالة لفولتية الانحياز . لقياس تيار الظلام تم وضع الكاشف المصنوع من CdTe في حالة ظلام وربط اقطاب النموذج مع الدائرة الكهربائية ثم أخذت القراءات باستخدام مقياس التيار الرقمي digital electrometer للتسجيل قيم التيار الظلام ثم استخدام مجهز قدرة ذي فولتية متغيرة لتسلیط فولتية الانحياز على طرف الكاشف وترأوا حتى قيم فولتية الانحياز الامامي بين ١٠٠-٧٥٠ v ولقياس تيار الأضاءة تستخدم نفس الدائرة الكهربائية ولكن يعرض الكاشف الى مصدر ضوئي (ضوء أبيض) وبشدات مختلفة -٧٥٠- ٥٠٠ Lux . أما بالنسبة للتوصيلية المستمرة فقد نظم حسانها باستخدام العلاقة

$$\sigma_{\text{FRA}} \dots ]$$

$\sigma$  لـ **الصنبة** . **النسبة** بين قطبي **R** مقاومة **A** مساحة مقطع **C** كثافة .  
**الكتف** و **النخرج** تحققانه التي تقتل مقلوب **الصنبة** . **متراسة** تغير **النسبة** و **المقاومة** مع **الفرز** مستخدماً **جيزي CR1** (اقياس كل من **النسبة** و **المقاومة** مع **تردد** ضمن المدى )

موجة الضوء الساقط . أما الكواشف الفوتونية فإن عملية امتصاص طاقة الضوء الساقط تسبب مباشرةً انبعاث الكترونات من سطح المادة لذا فإن الخرج للكواشف الفوتونية محكم بواسطة معدل امتصاص الفوتونات بشكل مباشر [6,7,8]

ان عملية الكشف تحتاج الى حد ادنى من الطاقة كبداية ولذلك يجب ان تكون طاقة الفوتون الساقط على الاقل متساوية لمقدار فجوة الطاقة لشبكة الموصل [9].

وتحتفل الكواشف الحرارية عن الكواشف الفتوتوبية لكونها تستجيب لكافة الأطوال الموجية بشكل متساوي . اذ يتم امتصاص طاقة الشعاع الساقط الذي يتحول الى حرارة مما يسبب حدوث تغيرات في الخصائص الفيزيائية لمادة الكاشف (pyroelectric) و الذي يمتاز باستجابة عالية و ز من استجابة قصير و اعظم استجابة لهذه الكواشف تكون عند الاطوال الموجية الواقعه ضمن مناطق الاشعة تحت الحمراء [6].

اما الكواشف الفوتونية (الكمية) فهي الكواشف التي تستجيب لمعدل الفوتونات الساقطة على سطح الكاشف و تعمل على تحويل الاشارة الضوئية الى اشارة كهربائية [7].

الجانب العملي

تم تحضير نموذجي من بلورة (CdTe) ذات الاتجاهات [111] بطريقة برمجة [3] وذلك باخذ عينات ذات سمك (1mm) او ابعاد mm . [3] (4mm\*2.5

وتم العمل على عدة مراحل ، اولها اجراء بعض العمليات اليدوية والmekanikie على العينات مثل عملية الصقل والتلميع وذلك للتخلص من الاضرار التي تلحق بالعينات بعد قطعها من البلورة . وتمت العملية على النحو الآتي استخدام ورق صنفرة من كاربيد السليكون بدرجة نعومة 600 وكرب بورق صنفرة بدرجة نعومة 1200 (1100) بعد ذلك بدل ورق كاربيد السليكون بالقماش الخاص بالتعيم مع استعمال معجون الماس بحجم حبيبي 11/111 ونهاية بقطر حبيبي  $3\mu m$  . العملية الثانية هي عملية ترسيب لقطب من مادة الالمنيوم على طرف العينة ويسمى (0.001mm) بواسطة منظومة الترسيب الحراري في الفراغ باستخدام جهاز التبخير الحراري في الفراغ نوع (Lyhold Coating Unit) وكانت القطب بشكل مقليل والمسافة بينهما (0.5mm) ولن صح لاستخدام المغروم كونه ذو توصية جيدة وسهل الترسيب وتوفره بكثرة جداً ذلك تأخذ المجلد وتحتها على قاعدة

تصل الى منطقة الترددات العالية حيث تبدأ بالاستقرار اما القاومة ٨ فحسب الشكل (4) تكون في اقصى قيمة لها عند الترددات الواطنة ثم تبدا بالهبوط عند زيادة التردد .

الشكل (5) يوضح الاستجابة الطيفية ضمن المنطقة  $11 \text{ m}$  ( $0.66-0.86 \text{ m}$ ) كدالة للطول الموجي للكاشف CdTe النقي و  $\text{CdTe}_{\text{Cu}}$  ( $0.7-1 \text{ m}$ ) للكاشف المطعم بالنحاس بنسبة ١% و بدرجة حرارة الغرفة فلاحظ ازدياد الاستجابة الكشافية بزيادة الطول الموجي للاشعاع الساقط و هناك قمة لهذه الزيادة عند الطول  $\lambda_{\text{max}}$  والذي يساوي  $1 \text{ m}$  ٠.٧٨ للنقي وهناك قمتين عند الطول الموجي  $1 \text{ m}$  ( $0.8, 0.875 \text{ m}$ ) للكاشف المشوب بالنحاس . فهناك ازاحة طيفية نحو المنطقة تحت الحمراء red shift ان هذه الازاحة ترجع الى عملية التطعيم بمادة النحاس حيث تؤدي الى خلق مستويات موضعية في فجوة الطاقة مما يؤدي الى تضييق في الفجوة و يعطي بالنتيجة طول موجي اكبر اما الشكل (6) فيووضح تغير الكفاءة الكمية كدالة للطول الموجي للكاشف النقي والمطعم ان الكفاءة الكمية للكاشف  $\text{CdTe}$  % على  $31.8$  عند الطول الموجي  $1 \text{ m}$  بينما للمطعم فتساوي  $39.3 \%$  ،  $53.6 \%$  عند الاطوال الموجية  $1 \text{ m}$  ( $0.8, 0.875 \text{ m}$ ) على التوالي

الشكل (7) يوضح التوصيلية الضوئية للكاشف قبل و بعد التطعيم فهناك زيادة في التوصيلية الضوئية مع زيادة في شدة الاضاءة و من المعروف ان زيادة شدة الاستضاءة هي عملية تهيج للاكترونات فتزداد عدد حاملات الشحنة او الاسلة الى حزمة التوصيل

### الاستنتاجات

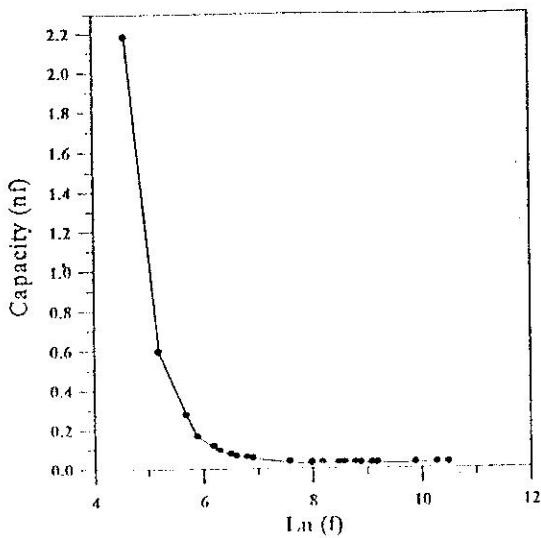
يعتبر الكاشف  $\text{CdTe}$  من الكاشف الفوتونية نتيجة لزيادة تيار الاضاءة بزيادة شدة الضوء المسلط عليه كذلك تقل السعة بزيادة التردد ضمن المدى  $(10^5 \rightarrow 10^2 \text{ Hz})$  كما وجد ان عملية التطعيم بالنحاس ادى الى تحسين في الخواص الكهربائية للكاشف و نقصان في العيوب التركيبية وهذا بروز في زيادة تياري الظلام و الاضاءة للكاشف بعد التطعيم من خلال المنحنيات قيد البحث هناك ازاحة طيفية نحو المنطقة تحت الحمراء و اخيرا هناك تحسين في الكفاءة الكمية للكاشف بعد التطعيم  $53 \%$  بالمقارنة مع  $1.8 \%$  قبل التطعيم .

**١٠١٧** دراسة بعض الخواص الحرفيه في حالة الظلام

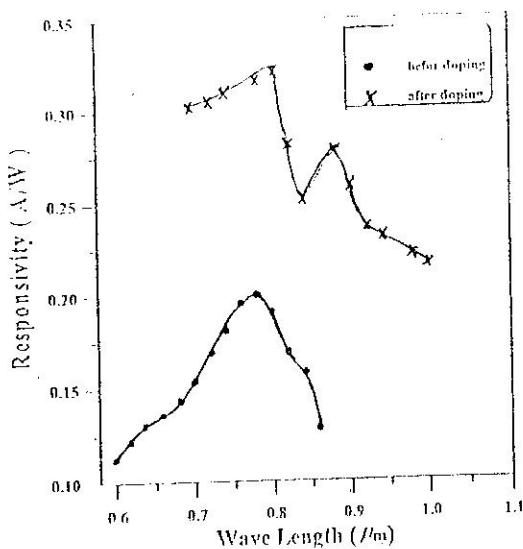
### النتائج والمناقشة

عدد دراسة خصائص (I-V) في حالة الظلام للسلاج المحضر لوحظ ان قيم تيار الظلام يزيد بزيادة فولتية الانحياز المسلطة على طرف للكاشف  $\text{CdTe:Cu,CdTe}$  كما موضح بالشكل (1).

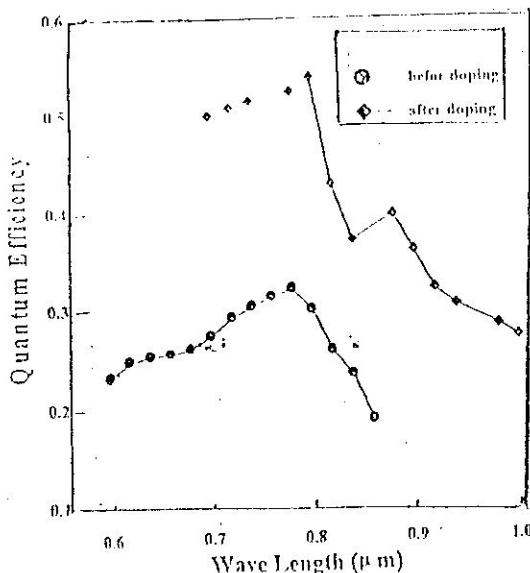
ذلك ممكن ملاحظة ان قيم تيار الظلام في حالة الكاشف  $\text{CdTe}$  أعلى من القيم المنشورة للكاشف الغير مطعم والسبب في ذلك يعود الى ان التشويب ادى الى نقصان في العيوب التركيبية المفترضة مما ادى الى زيادة في خواصها الضوئية وبالتالي تحسين في الخواص الكهربائية وكذلك من ملاحظة الشكل (1) ايضا نلاحظ انه عند قيم واطنة من تيار الظلام فإن التغير يكون خطيا وهذا ممكن ان يرجع الى احتمالية قصر حاملات الشحنة من قبل الشوابن اذا يخلف النحاس مستويات مبنية ضمن فجوة الطاقة [11,12] التي تمثل مراكز القبض و اعادة الاتحاد . كذلك ان استخدام قيم منخفضة من فولتية الانحياز تعنى ان هذا المجال المسلط تكون فيه سرعة الانجراف بطيئة بين قطبيين الكاشف و الناتجة عن قلة المجال الكهربائي المسلط [13] فحاملات الشحنة تحتاج الى وقت طويل للعبور بين قطبي الكاشف لأنها تقتصر من قبل هذه الشوابن المتمثلة بمراكم القبض وأعاد الاتحاد فتحصل على قيم قليلة من تيار الظلام . اما عند القيم العالية للفولتية المسلطة ف تكون سرعة الانجراف عالية فيقل اصطدام او قص حاملات الحركة . اما عند دراسة خواص التيار الضوئي يزداد بزيادة شدة الاضاءة المسلطة على طرف الكاشف  $\text{CdTe}$  وهذا يدل على زيادة تركيز حاملات الشحنة التي تصل عبر قطب الكاشف . اما في حالة الكاشف  $\text{CdTe:Cu}$  نلاحظ ان التيار الضوئي يزداد نتيجة لانخفاض شوابن النحاس مستويات موضعية داخل الفجوة والتي تعتبر مراكز حساسة للتولد و اعادة الاتحاد وبعد مقارنة تيار الاضاءة مع تيار الظلام نلاحظ ان تيار الاضاءة اكبر من تيار الظلام في الحالة النقية و الشائبة اذا تعلم زيادة شدة الاضاءة على زيادة تحركية حاملات الشحنة التي تصل الى حزمة التوصيل و نقصان في زمن العبور . امساك تأثير التردد على السعة و المقاومة فقد لوحظ من الشكل (3) ان السعة تكون اكبر ما يمكن عند السترات الواطنة ثم تبدا بالتناقص عند زيادة التردد الى ان



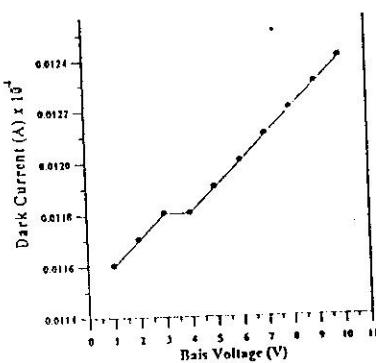
شكل (٤) تغير السعة مع التردد قبل التشويب



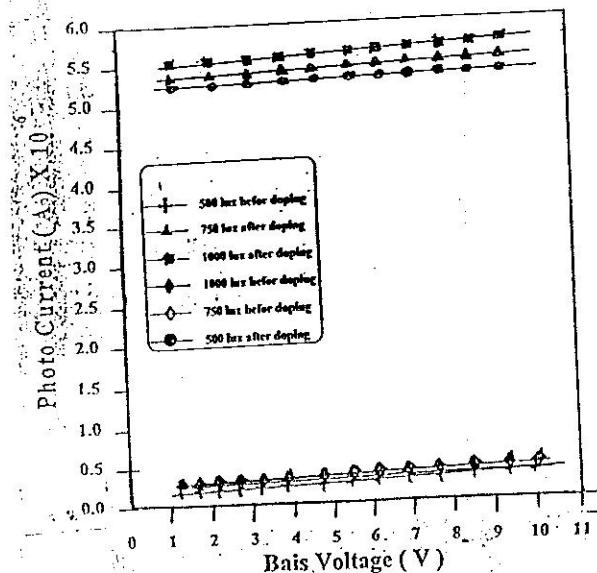
شكل (٥) تغير الاستجابة كدالة لطول الموجة قبل وبعد التدوير



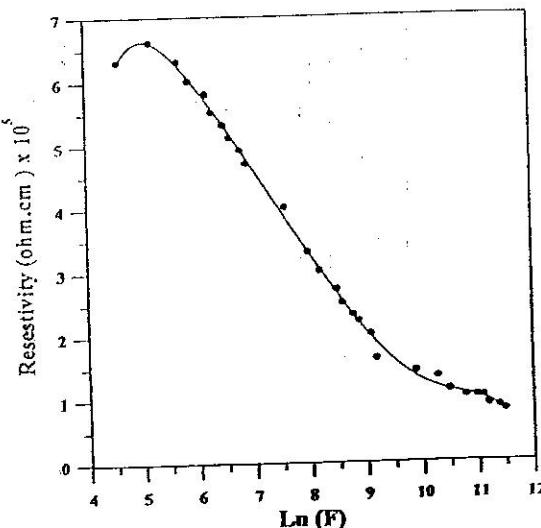
شكل (٦) تغير الكفاءة الكمية كدالة لطول الموجة قبل وبعد التدوير



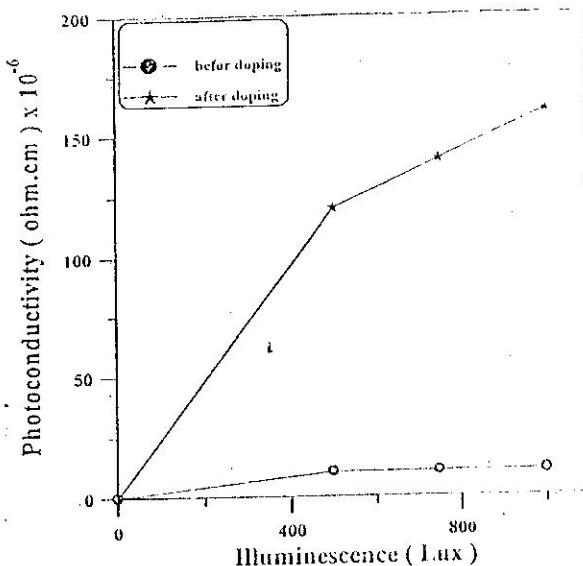
شكل (١) تغير تيار الضلام مع قوامية الأجهزة قبل التشويب



شكل (٢) تغير تيار الأضئاف مع قوامية الأجهزة قبل وبعد التشويب



شكل (٣) تغير المقاومة مع التردد قبل التشويب



شكل (٧) تغير المقاومة على الضوء بتأثير كثافة الشدة الإشعاعية للكاشف قبل و بعد التدوير

### المصادر

7. Hudson, R.D. JR , 1969 Infrared System Engineering John Wiley and Sons,
8. Othmer, Kirk- 1983 Encyclopedia of Chemical Technologe 3rd ed ; V.17 ,John Wiley and sons .
9. Turtan ,R. 2000 The physics of solids Oxford Uni .press .
10. صباح نوري. 2000 تصميم كوفت من مادة Si-GaAs. تesis لنيلسان تحت إشراف د. رسلة مجتبى. كلية نيلسان .جامعة بغداد .
11. Chamonal ,J.P. Molva E . and Pautrat,J.L. 1982 solid state Communie 43(11):801
12. Molva,E . Pautrat,J.L. Saminadayar,K. Milchberg,G. and Maynb,N. 1984 ,Solid State Communication 30(6):3344,
13. Green,M.A. 1989 solar Cells, translated by Y.M. Hassan,,
1. Zanio,K, 1978 cadmium telluride in :semiconductors and semimetals , Vol 13 ,Eds . R.K. Willar Dson and A.C. Berr , Academic Press , New York
2. Kittl,C ,1976 Introduction to Solid state physics 6<sup>th</sup> ed .Wiley, .
٣. مقادسي، مازن بطرس. 2001 التمو البليوري لمركب الكادميوم تلراید CdTe رسالة ماجستير الكلية الهندسية العسكرية .
٤. الفوادی، ایمان مزہر ناصر. 1999 تصميم كواشف التوصيل الثنائي سيليكونيد الكادميوم المطعمن بالنيحاس CdSe:Cu بطريقة التبخیر الحراري في الفراغ ودراسة خصائصه الكهربائية .رسالة ماجستير كلية التربية للبنات .جامعة بغداد .
5. Neaman, D.A. 1992 semiconductor physics and Devices Donnelly and Sons Company ..
٦. حمادي، حسن، وآخرون. 1989 اشعة اليزر و استخداماتها مطبعة دار الحكمة .

## Designe of CdTe Photoconductor detector and study of some electrical properties of CdTe crystal

\*S.A.Hasoon \*\*Z.T. Al-Dahan \*\*\*A.A. Mahmoud

\*Department of Physics-College of Science for Women-University of  
Baghdad

\*\* Department of Laser engenering and opto-electronics-Al-Nahrain  
University

\*\*\*

### Abstract

The photoconductive detector CdTe was fabricated in the form of metal-semiconductor contact by using method of deposite of Al electrode on wafers of experimental grown of CdTe crystal in [111] direction thermal tratement also made at  $80^{\circ}\text{C}$  during 30 min. De electrical properties and detection characteristic for pure and doped samples with copper also carried out for the reason of studying, the effect of doping by copper as well as frequency on the resistance of detector.